# 毛细管 X 光透镜聚焦的微束能量 色散 X 射线衍射分析的研究

段泽明<sup>1,2</sup>,姜其立<sup>1,2</sup>,刘俊<sup>1,2</sup>,潘秋丽<sup>1,2</sup>,程琳<sup>1,2</sup>\*

1北京师范大学核科学与技术学院射线束技术与材料改性教育部重点实验室,北京 100875;

<sup>2</sup>北京市辐射中心,北京 100875

**摘要** 微束能量色散 X 射线衍射(EDXRD)分析在测量小样品或样品微区的物相结构方面具有重要的应用前景。 提出了一种采用自行研发的微束 X 射线荧光谱仪进行微束能量色散 X 射线衍射分析的研究方法。用便携式毛细 管 X 光透镜聚焦的微束 X 射线荧光谱仪(焦斑直径为 190.7 μm)对人民币 5 角硬币"角"部分长×宽为4 mm× 4 mm的微区进行微束能量色散的 X 射线衍射扫描测量,并进行数据处理,得到该区域内 Cu<sub>3</sub> Sn(0 8 3)和 CuO(2 0 2)等晶相的分布;同时,用台式毛细管 X 光透镜聚焦的微束 X 射线荧光谱仪(焦斑直径为 31 μm)对一颗 直径约为1 mm 的矿石颗粒进行微束能量色散的 X 射线衍射二维扫描分析,得到扫描区域内 SiO<sub>2</sub>(3 2 9)和 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(1 1 6)等晶相的分布。结果表明,毛细管 X 光透镜聚焦的微束 X 射线荧光谱仪在开展小样品或样品微区的 能量色散 X 射线衍射分析方面具有一定的应用前景。

关键词 光谱学; 微区能量色散 X 射线衍射; 毛细管 X 光透镜; 微束 X 射线荧光谱仪; 矿石; 微区; 小样品
 中图分类号 O657.34 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201838.1230002

# Micro Energy Dispersive X-Ray Diffraction Analysis by Polycapillary X-Ray Optics Focusing

Duan Zeming<sup>1,2</sup>, Jiang Qili<sup>1,2</sup>, Liu Jun<sup>1,2</sup>, Pan Qiuli<sup>1,2</sup>, Cheng Lin<sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup>Key Laboratory of Beam Technology and Material Modification of Ministry of Education, College of Nuclear Science and Technology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; <sup>2</sup>Beijing Radiation Center, Beijing 100875, China

Abstract Micro energy dispersive X-ray diffraction (EDXRD) analysis has importance application prospects in measuring the phase structure of small samples or sample micro-area. A novel method of micro EDXRD analysis using a self-development micro X-ray fluorescence spectrometer is proposed. The two-dimensional scan of a 4 mm  $\times$  4 mm mico-area on the surface of a RMB-5-Jiao coin is made by a portable micro-beam X-ray fluorescence spectrometer based on polycapillary X-ray optics focusing (focal spot diameter is 190.7  $\mu$ m). After the obtained data are processed, the mappings of Cu<sub>3</sub> Sn (0 8 3), CuO(2 0 2) and other crystal phases are presented. Simultaneously, the two-dimensional scan of an ore particle with diameter of about 1 mm is also made by a desktop micro-beam X-ray fluorescence spectrometer based on polycapillary X-ray optics focusing (focal spot diameter is 31  $\mu$ m). The mappings of SiO<sub>2</sub> (3 2 9), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (1 1 6) and other crystal phases are also presented. The results show that the micro-beam X-ray fluorescence spectrometer based on polycapillary X-ray optics focusing has a potential application in the micro energy dispersion X-ray diffraction analysis of small samples or micro-areas of samples. Key words spectroscopy; micro-area energy dispersion X-ray diffraction; polycapillary X-ray optics; micro-beam

X-ray fluorescence spectrometer; ore; micro-area; small sample

**OCIS codes** 300.6560; 160.2750; 180.7460

基金项目:国家自然科学基金(11175022,11575026)、北京市自然科学基金(1162006)

\* E-mail: chenglin@bnu.edu.cn

收稿日期: 2018-06-28; 修回日期: 2018-07-30; 录用日期: 2018-08-13

# 1引言

X射线衍射(XRD)是分析物质结构的重要手 段,在20世纪70年代末到80年代初就被用于研究 材料表层结构和成分分布,现已被广泛应用到物理、 化学、地球科学和材料科学等各领域[1-5]。随着环 境、地学和材料等科学领域的发展,需要对直径小于 1 mm 的小颗粒样品或样品微区的晶相结构进行分 析,但现有的商业化 XRD 仪出射的 X 射线束斑的 长×宽一般约为1 mm×10 mm,很难满足小样品 的分析需求<sup>[6]</sup>。毛细管 X 光透镜是一种会聚 X 射 线束的光学器件,能将 X 射线管激发出的 X 射线束 会聚成直径可达几十微米的 X 射线束斑,并且能使 2~12 keV 能量范围内的 X 射线在焦斑处的能量放 大 2~3个数量级<sup>[7-8]</sup>。能量色散 X 射线衍射 (EDXRD)是在照射样品的 X 射线束和 X 射线探测 器等角度固定不变的条件下,用多能量的 X 射线束 照射样品。根据布拉格原理,采用 X 射线探测器探 测被样品衍射出的 X 射线束的方法获得样品物相 结构的信息时,与常规的角散射 XRD 相比,EDXRD 有诸多优点<sup>[9]</sup>,已被广泛应用于材料分析、物证鉴别 等方面<sup>[10]</sup>。本文尝试将毛细管 X 光透镜会聚 X 射 线的技术与 EDXRD 方法相结合,开展能量色散的 微束 XRD 分析的方法学研究,探索基于能量色散 的微束 XRD 分析方法的可行性。

#### 2 实 验

## 2.1 毛细管 X 光透镜

毛细管 X 光透镜是一种利用全反射原理设计 的 X 射线光学器件,是由几百万根内径为几微米的 空心玻璃管在高温作用下融合而成,其示意图如 图 1 所示。其中,F<sub>1</sub>为透镜的前焦距,即 X 射线点 光源到透镜入口端的距离;L 为透镜的长度;F<sub>2</sub>为 透镜的后焦距,即透镜出口端到 X 射线焦斑的距 离。毛细管 X 光透镜使从点光源发出的 X 射线束 进入空心毛细玻璃管,并在其内壁发生全反射进行 传输,再利用空心玻璃管的弯曲来改变 X 射线的传 输方向,从而将 X 射线束聚焦成直径可达几十微米 的焦斑,且使微区的 X 射线束强度提高 2~3 个数 量级。

## 2.2 实验设备

本实验由自行研发的微束能量色散 X 射线荧 光谱仪完成。主要设备包括:微焦斑 X 射线管 (Röntgen 公司,德国)、SDD(Silicon Drift Detector)X



射线探测器(Amptek 公司,美国,能量为 5.9 keV 时能量分辨率为 145 eV,铍窗有效面积为 25 mm<sup>2</sup>)、 毛细管 X 光透镜、激光笔、高精度的激光位移传感 器、具有 1400 万像素和 20 倍放大功能的 CCD (Charge-Coupled Device)相机、三维样品台和西门 子可编程逻辑控制器(PLC)控制系统等。其中,微 焦斑 X 射线管、X 射线探测器与水平面的夹角均为 45°,分布在 CCD 相机两侧。X 射线束轴线、探测器 轴线、激光笔光束轴线与 CCD 轴线会聚于 X 射线 焦斑处。光谱仪控制软件是基于 LabVIEW 语言环 境<sup>[11-13]</sup>开发的。

## 3 结果与分析

实际测量中,样品中感兴趣元素的含量,及需 要扫描分析的样品区域的大小等因素,都会导致 分析样品的速度和扫描总时间有差异。如果样品 的扫描区域较大但 X 射线照射样品的焦斑较小, 就会导致样品测量总时间过长;若扫描区域较小 而探测焦斑较大,就会导致元素扫描成像的分辨 率较差等。因此,在实验中一般会根据样品分析 的需求,选择合适的毛细管 X 光透镜。为了满足 不同大小扫描区域的分析需求,实验中选择配置 了焦斑直径为 190.7 μm 的毛细管 X 光透镜的便 携式微束 X 射线荧光谱仪和配置了焦斑直径为 31 μm的毛细管 X 光透镜的台式微束 X 射线荧光 谱仪进行测量分析。

#### 3.1 硬币表面微区 EDXRD 二维扫描分析

为了测量样品微区的晶相分布,选择一枚人民币5角硬币作为实验样品,扫描区域为硬币表面上的"角"字部分,区域尺寸为4 mm×4 mm,如图2 所示。由于扫描区域较大,所以为了获得合适的扫描总时间和成像分辨率,选择探测焦斑直径为190.7  $\mu$ m的便携式微束能量色散 X 射线荧光谱仪<sup>[14]</sup>进行测量。实验电压为 30 kV,电流为 0.6 mA,扫描步距为 100  $\mu$ m,每个点的探测活时间为 20 s。样品扫描区域的 X 射线能谱如图 3 所示。

根据普朗克公式:

$$E = \frac{hc}{\lambda},\tag{1}$$



图 2 硬币样品扫描区域示意图

Fig. 2 Schematic of scanning area of coin sample

式中 h 为普朗克常数,c 为光速,λ 为光子波长。再结合布拉格公式,将衍射峰的能量 E 转化为其对应的晶面间距 d,即

$$d = \frac{hc}{2E\sin\theta}n\,,\tag{2}$$

式中 θ 为衍射角度, n 为衍射级数。

将计算的 d 与相应物相的 PDF 卡片进行对比, CuO 等物质的不同者 得到晶面指数 ( $h \ k \ l$ ),结果如表 1 所示。采用 区域晶相 Cu<sub>3</sub> Sn(0 8 PyMca 软件<sup>[15-16]</sup>处理本实验扫描所得的 1600 个 能谱,得到如图 4 所示的晶相分布。为了验证本谱 pert-pro-MPD 型 XF 仪分析结果的准确性,采用荷兰帕纳科公司生产的 据与 EDXRD 分析结 表 1 本谱仪测量硬币样品表面微区数据和参考数据





Fig. 3 Energy spectrum in scanning area of coin sample

X-pert-pro-MPD型 XRD 仪对实验样品进行 XRD 分析,结果如图 5 所示。

由图 3 可知, EDXRD 方法不仅可以测出硬币 表面 Cu、Sn 等不同元素,还可以测出 Cu<sub>3</sub> Sn、Cu、 CuO 等物质的不同晶相。由图 4 可知,"角"字图案 区域晶相 Cu<sub>3</sub> Sn(0 8 3)和 Sn(6 4 2)相对含量高,而 CuO(2 0 2)相对含量低。由图 5 可知,通过对比 Xpert-pro-MPD型 XRD 仪的样品扫描 XRD 分析数 据与 EDXRD 分析结果发现,二者基本一致。

Table 1	Micro-area	data	of coin	sample	measured	hy o	ur spectrometer	and	reference	dat

Measurement data			Reference data			
$E / \rm keV$	n d/nm		PDF card number	d /nm	$(h \ k \ l)$	
6.34	1	0.1385	$Cu_3 Sn \# 01-1240$	0.1380	(083)	
7.59	1	0.1155	CuO # 45-0937	0.1155	(4 0 0)	
10.10	1	0.0869	Sn # 05-0390	0.0867	(6 4 2)	
11.22	2	0.1563	CuO # 48-1548	0.1582	(2 0 2)	
11.90	2	0.1474	$Cu_2 O $ # 34-1354	0.1486	(220)	
13.65	2	0.1284	Cu # 04-0836	0.1278	(220)	
15.10	2	0.1162	CuO # 45-0937	0.1161	(2 2 2)	
16.01	2	0.1095	Cu # 04-0836	0.1090	(3 1 1)	

Intensity /arb. units

max

min



图 4 硬币样品扫描区域晶相分布。(a) Cu<sub>3</sub>Sn(0 8 3); (b) Sn(6 4 2); (c) CuO(2 0 2)



## 3.2 小矿石颗粒 EDXRD 二维扫描分析

为了探测小颗粒样品的晶相或晶相分布,选择 如图 6 所示的直径为 1 mm 左右的微小矿石颗粒作 为实验样品。样品较小,因此,为了获得合适的测量 总时间和成像分辨率,选用探测焦斑直径为 31 μm 的台式微束能量色散 X 射线荧光谱仪对矿石颗粒 整体进行二维扫描。在 X 光管电压为 30 kV,电流 为 0.7 mA,每个点探测活时间为 5 s,扫描步距为 30 μm的实验条件下进行测量,得到的扫描区域的 X 射线能谱如图 7 所示。利用(1)式和(2)式计算出 各个衍射峰对应的晶面间距 d,与相应物相的 PDF



图 5 X-pert-pro-MPD型 XRD 仪测量硬币样品能谱图

Fig. 5 Energy spectrum of coin sample measured by X-pert-pro-MPD XRD spectrometer



图 6 矿石颗粒样品 Fig. 6 Ore particle sample

卡片进行对比,得到晶面指数(*h k l*),结果如表 2 所示。采用 PyMCA 软件处理扫描得到的所有 X 射 线能谱,可得到如图 8 所示的扫描区域的晶相分布。

由图 7 可知,毛细管 X 光透镜聚焦微束 X 射线 的分析方法不仅可以测出矿石颗粒中的主要元素 Si 和 Fe,还可以测出 Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>等物质的不同晶 相。其中,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的存在解释了矿石颗粒表面呈红色 的原因。除此之外,从图 8 中可以得出Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(116)、 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(0210)、SiO<sub>2</sub>(329)和 SiO<sub>2</sub>(314)等不同





图 8 矿石颗粒样品扫描区域晶相分布。(a) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(116);
(b) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(0210); (c) SiO<sub>2</sub>(329); (d) SiO<sub>2</sub>(314)
Fig. 8 Crystal phase mappings in scanning area of ore particle sample. (a) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(116); (b) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(0210);
(c) SiO<sub>2</sub>(329); (d) SiO<sub>2</sub>(314)

晶相在整个矿石颗粒中的分布情况,这对研究矿石 颗粒的形成过程及其类别具有一定的参考价值。

表 2 本谱仪测量矿石颗粒样品数据和参考数据	
------------------------	--

	Measurement	data	Reference data			
$E / \mathrm{keV}$	n	d /nm	PDF card number	d /nm	$(h \ k \ l)$	
2.48	1	0.3535	SiO <sub>2</sub> # 51-1380	0.3523	(-510)	
3.30	1	0.2657	$Fe_2O_3 \ \# \ 40-1139$	0.2648	(116)	
3.67	1	0.2389	$SiO_2 # 51-1377$	0.2381	(3 1 4)	
4.44	1	0.1974	$Fe_2 O_3 \ \# \ 16-0653$	0.1973	(-4 4 1)	
5.04	1	0.1739	$SiO_2 # 51-1382$	0.1738	(3 2 9)	
7.53	1	0.1164	$Fe_2 O_3 \ \# \ 33-0664$	0.1163	(0 2 10)	
10.04	1	0.0873	$SiO_2 # 27-0605$	0.0871	(733)	
12.49	2	0.1404	$SiO_2 \ \# 52-1425$	0.1404	(514)	
14.97	2	0.1171	$SiO_2 # 14-0654$	0.1171	(-482)	

Table 2 Data of ore particle sample measured by our spectrometer and reference data

## 4 结 论

利用毛细管 X 光透镜聚焦的微束能量色散 X 射线荧光谱仪,对 5 角硬币的微区和微小矿石颗粒 分别进行了能量色散的微束 XRD 分析,经过数据 处理不仅可以得到二者的物相,还可以得到扫描区 域内各晶相的分布。实验结果表明,毛细管 X 光透 镜聚焦的微束 EDXRD 在小样品或样品微区的晶相 分析研究领域具有一定的应用前景。

#### 参考文献

- [1] Yang Y, Liu W H, Bhargava S K, et al. A XANES and XRD study of chalcopyrite bioleaching with pyrite[J]. Minerals Engineering, 2016, 89: 157-162.
- [2] Sayed M H, Brandl M, Chory C, et al. In-situ XRD investigation of re-crystallization and selenization of CZTS nanoparticles[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 686: 24-29.
- [3] Dikmen G, Alver Ö, Parlak C. NMR determination of solvent dependent behavior and XRD structural properties of 4-carboxy phenylboronic acid: a DFT supported study[J]. Chemical Physics Letters, 2018, 698: 114-119.
- [4] Cao Y P, Chen H T, Feng A X, et al. Correlation between X-ray diffraction pattern and microstructure of laser shock processed 7050-T7451 aluminum alloy surface[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(5): 0502003.

曹宇鹏, 陈浩天, 冯爱新, 等. 激光冲击 7050-T7451 铝合金表面的 X 射线衍射图谱与微结构的相关 性[J]. 中国激光, 2018, 45(5): 0502003.

- [5] Tang B, Hei D W, Ma G, et al. Flash X-ray diffraction measurement of LiF crystal deformation under shock loading[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(6): 0634001.
  唐波,黑东炜,马戈,等.冲击加载下 LiF 晶格形变的闪光 X 射线衍射测量[J].光学学报, 2017, 37(6): 0634001.
- [6] Fan G, Ge X K. Application example of micro X-ray diffraction in mineral identification[J]. World Nuclear Geoscience, 2010, 27(2): 85-89.
  范光, 葛祥坤. 微区 X 射线衍射在矿物鉴定中的应用实例[J]. 世界核地质科学, 2010, 27(2): 85-89.
- [7] Hampai D, Dabagov S B, Cappuccio G. Advanced studies on the polycapillary optics use at XLab Frascati[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2015, 355: 264-267.
- [8] Hampai D, Cappuccio G, Cibin G, et al. Modeling of X-ray transport through polycapillary optics[J]. Nuclear

Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2007, 580(1): 85-89.

- [9] Sosa C M, Sánchez H J, Pérez C A, et al. Structural and elemental X-ray microanalysis with synchrotron radiation in confocal geometry[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2014, 319: 171-176.
- [10] Wang J L, Duan Z M, Cao J H, et al. Study on energy dispersive X-ray scattering technique with polycapillary X-ray optics for identification of sorts of liquids[J]. Acta Optica Sinica, 2016, 36(1): 0129003.
  王君玲, 段泽明,曹金浩,等. 毛细管 X 光透镜的能 量色散 X 射线散射技术识别液体种类的方法研 究[J]. 光学学报, 2016, 36(1): 0129003.
- [11] Sánchez-Alvarez A, Luna-Moreno D, Hernández-Morales J A, et al. Control of stepper motor rotary stages applied to optical sensing technique using LabView[J]. Optik, 2018, 164: 65-71.
- [12] Wang S D, He M. Data acquisition system applied research based on LabVIEW[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2014, 33(6): 103-106.
  王树东,何明. LabVIEW 在数据采集系统中的应用 研究[J]. 国外电子测量技术, 2014, 33(6): 103-106.
- [13] Chen F B, Chai H L, Gao J M. Design of the automatic testing platform based on LabVIEW[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2012, 31(11): 9-14.
  陈福彬,柴海莉,高晶敏.基于 LabVIEW 的自动化测 试平台的设计[J]. 国外电子测量技术, 2012, 31(11):

9-14.
[14] Duan Z M, Liu J, Jiang Q L, et al. Development of portable micro-X-ray fluorescence spectrometer [J]. Atomic Energy Science and Technology, 2018. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2044.TL.20180809.1155.006.html
段泽明,刘俊,姜其立,等.便携式微束 X 射线荧光 谱仪的研发 [J].原子能科学技术,2018.http://huma.http://http://huma.http://http://huma.http://htt

kns. cnki. net/kcms/detail/11. 2044. TL. 20180809. 1155.006.html

- [15] Senesi G S, Allegretta I, Porfido C, et al. Application of micro X-ray fluorescence and micro computed tomography to the study of laser cleaning efficiency on limestone monuments covered by black crusts[J]. Talanta, 2018, 178: 419-425.
- [16] Schoonjans T, Solé V A, Vincze L, et al. A general Monte Carlo simulation of energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometers—Part 6. Quantification through iterative simulations[J]. Spectrochimica Acta Part B, 2013, 82: 36-41.